

IRエミッション顕微鏡 THEMOS-1000 オペレーショントレーニング開催のお知らせ

On-site Training of Thermal Emission Microscope

(Please it should be noted, all description will be Japanese.)

本装置の筑波大学のオープンファシリティ（OF）システムへの登録に併せ、IRエミッション顕微鏡 THEMOS-1000（浜松ホトニクス社製）メーカースタッフによるオペレーショントレーニングを開催いたします。ご使用予定の方、発熱画像解析装置に興味をお持ちの方は是非ともお越しく下さい。

特 徴

半導体デバイスの故障に起因する発光・発熱などをとらえて故障個所を特定する高解像度エミッション顕微鏡です。本装置にはInSbHRカメラが搭載されており裏面観察時においても高解像度・高コントラストで細部に渡ってクリアなパターン像を得ることが可能であり、発熱分布の時間依存性計測により温度の時間的な広がりも観測できます。

- ・検出波長： $3.7\mu\text{m}$ ～ $5.1\mu\text{m}$ 、雑音等価温度差：25mK
- ・最小空間分解能： $2.8\mu\text{m}$ 、時間分解能： $3\mu\text{sec}$

【日時】9月25日(火) 13:00～
9月26日(水) 10:00～

【場所】筑波大学 総合研究棟B 0022室

【内容】

- ・プローバー部の説明
- ・発熱解析についての説明
- ・メーカー標準試料を用いた実機操作
- ・各自の試料を用いた実機測定トレーニング（2日目）
- ・ご質問等その他

締切 9月18日（火）

お問い合わせ

国立大学法人筑波大学
数理工学系 パワーエレクトロニクス共用システム（パワエレ共用）
〒305-8577 茨城県つくば市天王台1-1-1

E-mail: sharing-power-e@ml.cc.tsukuba.ac.jp

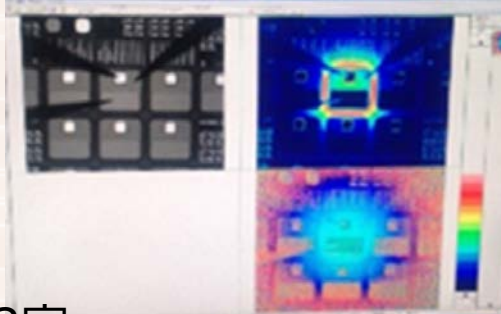
URL: <http://shared-pe.bk.tsukuba.ac.jp>

※ 件名に、「THEMOS-1000操作講習会応募」と記載いただき、所属機関、部署（研究室名）、氏名、職名（学年）、電話番号、E-mail アドレスをご連絡ください。

※ オープンファシリティの機器利用申請がお済みではない方は、事前に申請をお願いいたします。

<http://openfacility.sec.tsukuba.ac.jp/wp/riyou1/riyou5/>（学内参加者）

<http://openfacility.sec.tsukuba.ac.jp/public/regist/>（学外参加者: 有料での参加となります）



**参加者募集！
（若干名）**

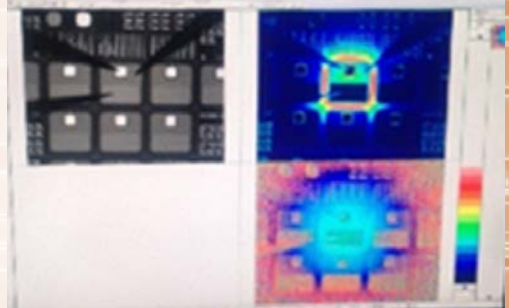
装置を熟知したメーカースタッフ
からお話がうかがえます。

On-site Training of Thermal Emission Microscope (THEMOS-1000)

In conjunction with the registration of this equipment in the Open Facility (OF) system of the University of Tsukuba, we will hold operation training by manufacturer staff of IR Emission Microscope (THEMOS-1000; Hamamatsu Photonics K.K.). Please come by all means if you plan to use this equipment.

Features and specification

The THEMOS (thermal emission microscope) is a semiconductor failure analysis system that pinpoints failures by detecting thermal emissions generated within the semiconductor device. By observing the infrared image, it is possible to detect the heat generation distribution (temperature distribution) and to identify the current leak location. Detection sensitivity : 3.7 μ m - 5.1, Spatial resolution : 2.8 μ m, Noise equivalent temperature difference (NETD) : 25mK, Time resolution : 3 μ sec.



【 Dates 】 25th Sep. (Tue.) 13:00~
26th Sep. (Wed.) 10:00~

【 Place 】 LABORATORY FOR ADVANCED
RESEARCH B 0022 ROOM

【 Contents 】

(Sorry, it should be noted, all description will be Japanese.)

- Description of the prober section
- Description of the thermal analysis
- Demonstration using standard sample
- Operation training using each sample (2nd day)
- Questions etc.



**Currently recruiting
some participants !**

By the deadline, 18th September

Contact Information

University of Tsukuba
Faculty of Pure and Applied Sciences
Sharing systems for power electronics equipment (Sharing-pe)

1-1-1 Tennoudai, Tsukuba City, Ibaraki, 305-8577, Japan

E-mail: sharing-power-e@ml.cc.tsukuba.ac.jp

URL: <http://shared-pe.bk.tsukuba.ac.jp>

※Please register this device using the Open Facility system in advance.

<http://openfacility.sec.tsukuba.ac.jp/wp/riyou1/riyou5/>